

NO.	題名	発表者	所属	分野
サンビーム				
S-01	ガス雰囲気変動下における貴金属の酸化還元特性の評価	谷口 達也	川崎重工業(株)	触媒化学/X線・軟X線吸収分光
S-02	XAFSとSANSを併用した鋼材表面の腐食過程の評価	横溝 臣智	(株)神戸製鋼所	金属・構造材料/X線・軟X線吸収分光
S-03	X線回折を用いたマルテンサイト鋼の評価法検討	北原 周	(株)神戸製鋼所	金属・構造材料/X線回折
S-04	硬質薄膜材料の残留応力測定	山口 浩司	住友電気工業(株)	金属・構造材料/X線回折
S-05	Ruコア/Ptシェル触媒ナノ粒子の表面電子状態における粒子サイズとコアの影響	後藤 習志	ソニー(株)	触媒化学/X線・軟X線吸収分光
S-06	X線回折によるNi基超合金のき裂先端変形挙動の評価	向井 康博	関西電力(株)	金属・構造材料/X線回折
S-07	XAFS法による微量な水銀の化学形態分析法	山本 融	(一財)電力中央研究所	エネルギー・資源/X線・軟X線吸収分光
S-08	半導体絶縁膜の結晶構造評価	高石 理一郎	(株)東芝	半導体・電子材料/X線回折
S-09	Naフラックス法で作製したGaNの結晶欠陥観察	加地 徹	(株)豊田中央研究所	半導体・電子材料/X線イメージング
S-10	はんだフラックスのSR-XRF分析	高橋 直子	(株)豊田中央研究所	半導体・電子材料/X線・軟X線吸収分光
S-11	放射光ラミノグラフィによるパワーモジュール構造の内部計測	木村 英彦	(株)豊田中央研究所	エレクトロニクス/X線イメージング
S-12	二次元検出器を用いたGaN非対称面のX線回折測定	宮野 宗彦	日亜化学工業(株)	半導体・電子材料/X線回折
S-13	DSC/SAXSによるポリアミドの高次構造解析	久保淵 啓	(株)日産アーク	有機材料/X線散乱
S-14	In situ XAFSと第一原理計算によるLiイオン2次電池の解析	与儀 千尋	(株)日産アーク	エネルギー・資源/X線・軟X線吸収分光
S-15	デラフォサイト型酸化物におけるeg軌道占有数の評価	宮田 伸弘	パナソニック(株)	触媒化学/X線・軟X線吸収分光
S-16	ミクロンサイズ磁石単結晶のヒステリシス測定	菅原 昭	(株)日立製作所	磁性材料/X線磁気散乱
S-17	サブピクセルシフト法を用いた高分解能CTの開発	米山 明男	(株)日立製作所	産業利用・その他/X線イメージング
S-18	多次元検出器とBL16回折計のLabVIEW、IDLによる統合制御ソフトの開発	淡路 直樹	(株)富士通研究所	産業利用・その他/X線回折
S-19	Sn-Bi-0.5Sb溶融半田における凝固過程その場観察	野村 健二	(株)富士通研究所	半導体・電子材料/X線回折
S-20	垂直配向カーボンナノチューブ膜の評価技術開発	土井 修一	(株)富士通研究所	無機材料/X線回折・散乱・吸収
S-21	水素化酸化インジウム薄膜の結晶化挙動	本谷 宗	三菱電機(株)	半導体電子材料/X線・軟X線分光
S-22	サンビームのHAXPES装置	吉木 昌彦	(株)東芝	産業利用・その他/光電子分光
S-23	サンビームの多次元検出器PILATUS/MYTHENの立上げ	北原 周	(株)神戸製鋼所	産業利用・その他/X線回折
JASRI共用ビームライン実施課題				
	トバモライト生成過程におけるCSHゲルの構造	松野 信也	旭化成(株)	
	パン気泡構造の3次元X線CT解析	浅田 達広	神戸大学大学院農学研究科	
	細胞間脂質に着目した皮膚疾患モデルの構造解析と治療薬開発への応用	小幡 誉子	星薬科大学	
	HAXPESによる埋もれたゴム-真鍮接着界面のその場化学状態解析	小澤 健一	東京工業大学大学院理工学研究科	
	顕微IRを用いた美容処理に伴う毛髪内システイン酸の生成挙動の可視化	伊藤 廉	(株)ミルボン中央研究所	
	部分蛍光収量測定による窒化物半導体中MgドーパントのXAFS解析	榊 篤史	日亜化学工業(株)	

NO.	題名	発表者	所属	分野
	放射光X線吸収分光によるFe固溶Li ₂ MnO ₃ 正極の充放電反応の解析	弓削 亮太	NEC スマートエネルギー研究所	
	放射光X線回折法による高圧下潤滑油の構造解析とトライボロジー特性との関連性	平山 朋子	同志社大学	
	GaN中の微量Mgの局所状態解析	米村 卓巳	住友電気工業(株)解析技術研究センター	
	燃え広がった可燃性固体内部の熱分解様相の非破壊微視的観察	大徳 忠史	秋田県立大学	
	X線分光法とメスbauer分光法を併用した金担持触媒のキャラクタリゼーション	大橋 弘範	九州大学基幹教育院	
	Liイオン二次電池用正極材料Li ₂ MnO ₃ の新しい高容量化技術	荒地 良典	関西大学	
	硬X線光電子分光法による有機EL素子界面の化学状態分析	安居 麻美	(株)東レリサーチセンター	
	回折コントラストトモグラフィーによる多結晶金属材料の疲労損傷評価	中井 善一	神戸大学大学院工学研究科	
	高温高圧アルコール水溶液を対象としたコンプトン散乱測定	渡邊 賢	東北大学大学院工学研究科化学工学専攻	
	HAXPESによるCZTS太陽電池のエネルギーバンド評価	片岡 恵太、 田島 伸	(株)豊田中央研究所	
	新形式ハイブリッド液水分布制御構造を有する固体高分子形燃料電池用GDLにおける酸素拡散特性と液水挙動の同時計測	是澤 亮	横浜国立大学	
	リチウム二次電池用正極材料の高温での熱分解過程の解明	小林 弘典	(独)産業技術総合研究所	
	Al ₂ O ₃ 表面修飾を施したリチウム二次電池正極活物質粒子の表面状態解析	小林 玄器	自然科学研究機構 分子科学研究所	
	放射光ラミノグラフィによる介在物起点の転動疲労き裂進展挙動の観察	牧野 泰三	新日鐵住金(株) 技術開発本部	
	光捕集ユニットを有するMOF光触媒の開発と可視光水素製造への応用	堀内 悠	大阪府立大学	
	固/水界面におけるヘアコンディショナーの吸着膜構造のXRおよびGIXDによるその場測定	大石 泉	ライオン(株) ビューティケア研究所	
	硬X線光電子分光法によるナトリウムイオン蓄電池用負極の表面構造解析	久保田 圭	東京理科大学	
兵庫県				
H-1	兵庫県ビームラインBL08B2の現状	放射光ナノテクセンター	公立大学法人兵庫県立大学	
H-2	兵庫県ビームラインBL24XUの現状	放射光ナノテクセンター	公立大学法人兵庫県立大学	
H-3	SAXSとRMCによる構造発色フィルムの光学特性発現機構の解析	首藤 靖幸	住友ベークライト(株)	
H-4	リオトロピックなクロモニク液晶の構造評価	鈴木 拓也	(株)MCHC R&Dシナジーセンター	
H-5	Si(111)上にMBE成長した(Er _{1-x} Sc _x) ₂ O ₃ 膜のGIXDおよびEXAFSによる評価	尾身 博雄	NTT物性科学基礎研究所	
H-6	Fe系陶磁器釉薬の発色機構に及ぼす融剤の影響	桐野 文良	東京藝術大学	
H-7	4D X線CT観察技術を用いた発泡機構の解明	中野 真也	Nitto	
H-8	放射光X線小角散乱法による動的条件下ゴム構造解析	大江 裕彰	東洋ゴム工業(株)	
H-9	Fe固溶Li ₂ MnO ₃ を用いたリチウムイオン二次電池の充放電反応	戸田 昭夫	日本電気(株)	
H-10	ポリビニルアルコールを用いたエマルジョン皮膜の小角X線散乱による構造解析	山本 友之	日本合成化学工業(株) 中央研究所 物性分析セ	
H-11	広角X線散乱その場測定による高シス含有ポリブタジエンの延伸結晶化に関する研究	京都工芸繊維大学 櫻井伸一	旭化成(株)	
H-12	兵庫県ビームラインを利用したリチウムイオン電池のin situ測定	東 遥介	(株)住化分析センター	
H-13	加齢に伴う毛髪内密度の変化とX線CTによる観察	伊藤 廉	(株)ミルボン	

NO.	題名	発表者	所属	分野
H-14	In-situ Zn K-edge XAFS/SAXS計測を用いたゴムの加硫反応研究	松本 典大	住友ゴム工業(株)	
H-15	マイクロビームを用いたリチウムイオン電池正極の分析	三根生 晋	マツダ(株)	
H-16	GaN結晶中の局所歪みによるInの偏析	平岩 美央里	パナソニック(株)	
H-17	NEXAFSを用いた光配向性高分子液晶薄膜の分子配向評価	春山 雄一	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	
H-18	TEY, TFYの併用によるSn表面酸化状態の深さ分析法の検討	新部 正人	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	
H-19	放射光を用いた空中映像素子DCRAの作製の検討	山根 朋久	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	
H-20	NewSUBARUガンマ線ビーム源を使った産業利用の展開	宮本 修治	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	
H-21	EUV大型光学素子測定用の大型反射率計の開発	原田 哲男	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	
H-22	ニュースバルBL10を利用した企業材料の放射光軟X線分析	村松 康司	兵庫県立大学高度産業科学技術研究所	
H-23	硬X線多層膜ゾーンプレートの高空間分解能化	角田 和浩	兵庫県立大学大学院物質理学研究科	
H-24	一次元全反射ラミナーゾーンプレートの開発	松村 篤恭	兵庫県立大学大学院物質理学研究科	
H-25	放射光X線によるNaフラックス法GaN単結晶基板の結晶性評価	福田 修平	兵庫県立大学大学院物質理学研究科	
豊田中央研究所				
T-01	放射光回折応力測定のための2次元検出器用スリットの開発	瀬戸山 大吾	(株)豊田中央研究所	金属・構造材料/X線回折
T-02	摩擦面その場XRDによる鋼材の焼付き現象解析	泉 貴士	(株)豊田中央研究所	金属・構造材料/X線回折
T-03	Cu/CeO ₂ 触媒によるNO還元反応	長井 康貴	(株)豊田中央研究所	触媒化学/X線・軟X線吸収分光
T-04	小角X線散乱法による樹脂の射出成形プロセス観察	松永 拓郎	(株)豊田中央研究所	有機材料/X線散乱
T-05	Liイオン電池過充電挙動のin situ XAFS・XRD解析	野中 敬正	(株)豊田中央研究所	電気化学/X線・軟X線吸収分光
T-06	時分割XAFSによるEPDMの架橋及び劣化解析	青木 良文	(株)豊田中央研究所	化学・高分子化学/X線・軟X線吸収分光
T-07	可視光応答P型半導体材料のXAFS解析	野中 敬正	(株)豊田中央研究所	半導体・電子材料/X線・軟X線吸収分光
FSBL (フロンティアソフトマター)				
F-01	高分子ナノ吸着層-形成過程と結晶化への影響	浅田 光則	(株)クラレ	
F-02	小角X線散乱による塗工膜形成過程のその場観察技術の構築	下北 啓輔	日東電工(株)	
JASRI産業利用推進室				
I-01	BL19B2、BL14B2、BL46XUの機器整備及びEXDM技術の開発状況	産業利用推進室	(公財)高輝度光科学研究センター	
その他				
O-1	SPRUC 企業利用研究会の概要	巽 修平、佐野 則道	企業利用研究会	